УДК 532.783, 535.326, 535,512

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ДОМЕНОВ, ЗОНДИРУЕМЫХ СФОКУСИРОВАННЫМ ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ

© 2017 г. А. М. Паршин^{*,**}, кандидат физ.-мат. наук *Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск **Сибирский федеральный университет, Красноярск

E-mail: <u>parshin@iph.krasn.ru</u>

Представлена методика определения оптических характеристик доменных структур нематических жидких кристаллов с использованием сфокусированного лазерного луча. Получены зависимости интенсивности поляризованного света от электрического напряжения для отдельного домена нематика, сформированного поверхностью поликарбоната в присутствии Показано, ЧТО магнитного поля. оптические характеристики нельзя интерпретировать в рамках концепции рассеяния света, пригодной для ансамбля доменов, широким лазерным лучом. зондируемым Анализ результатов проведен на основе положений градиентной оптики.

Ключевые слова: лазерное излучение, интенсивность света, интерференция, жидкий кристалл, поликарбонат.

Коды OCIS: 160.3710, 230.3720, 260.3160

Поступила в редакцию_____

Введение

Лазерное излучение, вследствие его высокой монохроматичности и широко используется в жидкокристаллических (ЖК) интенсивности, устройствах оптической обработки информации [1]. Анализ оптического пропускания зондирующего лазерного луча позволяет обнаруживать новые эффекты в ЖК слоях, находящихся под воздействием ориентирующих поверхностей или внешних полей, которые могут быть использованы для создания новых ЖК технологий. В устройствах с однородным слоем ЖК директор изменяется постепенно от точки к точке, и оптические характеристики не зависят от поперечных размеров лазерного луча. В то же время, в неоднородных ЖК структурах получение достоверных оптических характеристик при использовании луча лазера является трудной задачей. К неоднородным структурам можно отнести композитные материалы с объемным расположением капель ЖК в изотропных матрицах [2,3]. Широкий лазерный луч при своем распространении через композит захватывает значительное количество микроскопических объемов ЖК и несет интегральную информацию об их оптических свойствах, к которым можно отнести характеристики рассеяния света и интерференционные эффекты. Анализ оптических характеристик композитов зависит OT соотношения диаметров капель d с длиной волны света λ и проводится при $d < \lambda$ в приближении Рэлей-Ганса и при $d > \lambda$ в приближении аномальной дифракции. Так, при исследовании капсулированных в полимерной матрице ЖК капель (КПЖК) диаметром $d \sim 1-10$ мкм [4,5] в рамках указанных приближений были объяснены результаты изменения оптического пропускания под действием электрических полей. или магнитных Исследования в работе [6] показали, что механизм рассеяния в приближении аномальной дифракции остается справедливым в КПЖК пленках с однослойным расположением капель размером вплоть до $d \sim 25$ мкм. При этом оптические характеристики обусловливались фазовыми соотношениями

света, прошедшего через капли и через полимерную матрицу, то есть отличием показателей преломления ЖК и полимера. Однако для их получения оказалось необходимым использовать параметры, зависящие от размера, формы и внутренней структуры капель ЖК. Недавно нами были обнаружены и исследованы доменные структуры нематических ЖК, сформированные на поверхности поликарбоната (ПК) [7-9]. Домены имеют размеры d ~ 50-200 мкм и очень плотную упаковку на поверхности ПК. Данное обстоятельство затрудняет рассматривать характеристики света, прошедшего через их ансамбли, в рамках указанных приближений. В настоящей представлена методика статье определения оптических характеристик доменных структур ЖК с использованием сфокусированного лазерного луча, способного зондировать отдельные домены. Для анализа оптического пропускания деформированных структур ЖК использовалось электрическое и магнитное поле.

Методика эксперимента

Для получения оптических характеристик отдельного домена ЖК на поверхности ПК была собрана поляризационно-оптическая установка, схема которой представлена на рис. 1. Установка давала возможность пропускать через образец либо белый свет, либо лазерное излучение, и позволяла получать вольт-контрастные характеристики. Белый свет от галогеновой лампы *1*, отражаясь от зеркала *2*, проходил через полупрозрачную пластинку *3*, поляризатор *4*, линзу *5*, платформу *6* с образцом *7*, объектив *8*, анализатор *9* и, отклонившись призмой *10*, через окуляр *11* попадал в объектив цифровой камеры *12*. Горизонтально поляризованный луч Не-Ne лазера *13* ЛГН-302 с длиной волны $\lambda = 0.633$ мкм ослаблял свою интенсивность на фильтре *14* и, отражаясь от полупрозрачной пластинки *3*, проходил дальнейший путь до объектива камеры так же как пучок белого света. При выведении призмы *10* из оптического тракта лазерный луч попадал на фотодиод *15*.

Для фокусировки лазерного луча использовалась собирающая линза с фокусным расстоянием f = 30 мм. Известно, что линза не изменяет профиль луча, а изменяет лишь радиус кривизны и размер пятна, если луч является Гауссовым [10]. Профиль лазерного луча определялся с помощью профилометра LBP2 (Newport Corporation). Распределение относительной интенсивности луча I_{rel} (в процентах от максимального значения) в его поперечном сечении, расположенном в фокусе линзы, представлено в сноске (слева) на рис. 1. Из распределения видно, что луч имеет Гауссову форму, а его перетяжка w_0 , в которой радиальная ширина w имеет минимальное значение при z = 0, составляет ~ 25 мкм. В сноске (справа) на рис. 1 показан гиперболический контур луча 16, его перетяжка, поверхности постоянной фазы 17, а также энергетический профиль луча 18.

Для создания образца стеклянная пластина с проводящим ITO покрытием помещалась в центрифугу, и на нее осаждалась капля 2-%-го раствора ПК в CH₂Cl₂. После центрифугирования в течение несколько десятков секунд на подложке формировалась пленка ПК, на которую укладывались две тефлоновые прокладки толщиной 30 мкм. На прокладки помещалась стеклянная пластина с ITO проводящим покрытием, промытая в кипящем ацетоне и кипящем гексане. ЖК 4-*н*-пентил-4'-цианобифенил (5ЦБ) с последовательностью фазовых переходов Cr-22°C-N-34°C-I вводился в зазор между пластинами ячейки в нематической фазе. ЖК ячейка помещалась между полюсами электромагнита, и магнитное поле Н прикладывалось вдоль плоскости подложки в течение 20 мин. После удаления из магнита с использованием поляризационного микроскопа в образце можно было наблюдать ансамбль доменов ЖК круглой формы с проходящими через их центры вдоль диаметров линиями дисклинаций, перпендикулярными направлению прикладывания Н. Полученный образец платформу, способную перемещаться трех помещался на В Перемещаясь перпендикулярных направлениях. вертикальном В направлении, вдоль светового луча, платформа устанавливалась так, чтобы

слой ЖК в ячейке находился в фокусе линзы. Дополнительно платформа перемещалась в горизонтальной плоскости до тех пор, пока центральная область отдельного домена не оказывался на пути лазерного луча. При этом образец устанавливался так, чтобы вектор поляризации световой волны е был направлению прикладывания Н. С параллелен помощью камеры производился снимок. Затем призма и анализатор выводились из оптического тракта, источник белого света выключался, и к ячейке прикладывалось переменное электрическое напряжение U с частотой 1 кГц от генератора 19, которое регистрировалось вольтметром 20. Напряжение от фотодиода, пропорциональное интенсивности лазерного луча *I*, регистрировалось вольтметром 21. Сигналы от вольтметров через специальную плату поступали на компьютер 22. Цифровая камера также была подключена к компьютеру. С помощью программы LabVIEW прописывалась зависимость I(U). Затем образец поворачивался на 90° для того, чтобы вектор поляризации световой волны е был перпендикулярен направлению прикладывания H, и вновь регистрировалась кривая I(U).

Результаты и обсуждение

На рис. 2 представлена микрофотография ансамбля доменов 5ЦБ, сформированных на поверхности пленки ПК в присутствии магнитного поля H = 25 кЭ. Из рисунка видно, что все линии дисклинаций 1 ориентированы перпендикулярно направлению H. Данное обстоятельство позволило упростить ориентацию образца в поляризационно-оптической установке в положениях **e** || H или **e** \perp H.

На рис. 3 приведена зависимость I(U) для луча лазера, прошедшего через центр домена, для случая е || *H*. Зависимость сопровождается интерференционными эффектами после начала трансформации слоя ЖК при монотонном увеличении интенсивности с ростом напряжения вплоть до полей насыщения. На рис. 4 приведена такая же зависимость I(U) для случая $e \perp H$. На кривой также наблюдаются интерференционные изменения интенсивности лазерного излучения, но при ее монотонном уменьшении с ростом напряжения. Следует отметить, что представленные зависимости практически не изменялись при перемещении луча лазера относительно домена, то есть вклад в оптические характеристики от линий дисклинаций был незначителен.

Из анализа зависимостей на рис. 3 и рис. 4 можно сделать следующие заключения. Во-первых, кривые получены в отсутствие анализатора, поэтому они не могут быть интерпретированы на эффекте двулучепреломления ЖК. Во-вторых, оптические характеристики подобны тем, которые были получены для ансамбля доменов, зондируемых широким лазерным лучом [8]. Однако в данном случае они не могут быть объяснены отличием показателей преломления ЖК и полимера, так как весь свет проходит через домен и не захватывает полимерную матрицу. В-третьих, зависимости имеют разный характер при различных направлениях вектора поляризации относительно направления прикладывания магнитного поля *H*.

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом. Структура домена ЖК, сформированного поверхностью ПК в присутствии магнитного поля *H* [9], представлена на рис. 5. Радиальная конфигурация директора ЖК, сформированная на поверхности ПК, постепенно передается в объем нематического слоя и переходит на длине когерентности ξ в планарную ориентацию. При приложении напряжения U к образцу переориентация молекул нематика под действием электрического поля Е в каждом домене должна привести к изменению угла ориентации директора относительно оси z на длине когерентности ξ_E , а также к неоднородному молекулярному распределению плоскости (рис. 6). Данная В xv трансформация ЖК будет директора сопровождаться стремлением показателя преломления необыкновенного луча *n*_е к показателю преломления обыкновенного луча n_0 на расстоянии $\xi_{\rm E}$. Можно предположить, что вследствие неоднородного распределения показателей преломления В

плоскости *ху*, в домене возникнет эффект градиентной линзы, луч света в которой стремится отклониться в сторону большего показателя преломления [11,12]. При $\mathbf{e} \parallel H$ линза будет собирающей, а при $\mathbf{e} \perp H$ рассеивающей. В первом случае будет наблюдаться увеличение (рис. 3), а во втором уменьшение (рис. 4) интенсивности лазерного излучения с ростом напряжения.

Заключение

В настоящей статье представлена методика определения оптических характеристик доменных структур ЖК с использованием сфокусированного лазерного луча, способного зондировать отдельные домены. Оптические характеристики были получены для домена нематика 5ЦБ, сформированного поверхностью поликарбоната в присутствии магнитного поля *H*, с помощью поляризационно-оптической установки. Установка позволяла пропускать через образец либо белый свет, либо лазерное излучение; для фокусировки лазерного луча использовалась собирающая линза. Получены зависимости интенсивности І лазерного излучения с вектором поляризации е || Н или $\mathbf{e} \perp H$, прошедшего через домен нематика, от напряжения U. Зависимости сопровождаются интерференционными эффектами после начала трансформации слоя ЖК при монотонном увеличении или уменьшении интенсивности с ростом напряжения вплоть до полей насыщения. Данные оптические характеристики оказалось невозможным интерпретировать в рамках концепции рассеяния света, пригодной для ансамбля доменов, зондируемым широким лазерным лучом. Полученные результаты можно объяснить, если предположить, что, вследствие неоднородного распределения показателей преломления в сечении лазерного луча, в домене возникает эффект градиентной линзы, луч света в которой стремится отклониться в сторону большего показателя преломления.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российским Фондом Фундаментальных Исследований (проекты № 15-02-06924 и № 16-53-00073), а также за счет проектов СО РАН через комплексные программы № II.2P 0356-2015-0410 и № 0356-2015-041.

Литература

- 1. Томилин М.Г., Пестов С.М. Свойства жидкокристаллических материалов. Спб.: Политехника, 2005. 296 с.
- Drzaic P.S. Polymer dispersed nematic liquid crystal for area displays and light valves // J. Appl. Phys. 1986. V. 60. No 6. P. 2142-2148.
- West J.L., Doane J.W., Zumer S. Liquid crystal display material comprising a liquid crystal dispersion in a thermoplastic resin // US Patent No 4685771. 1987.
- Zumer S., Doane J.W. Light scattering from a small nematic droplet // Phys. Rev. A. 1986. V. 34. P. 3373–3386.
- Zumer S. Light scattering from nematic droplet: Anomalous-diffraction approach // Phys. Rev. A. 1988. V. 37. P. 4006–4015.
- Конколович А.В., Пресняков В.В., Зырянов В.Я., Лойко В.А., Шабанов В.Ф. Интерференционное гашение света, проходящего через монослойную пленку капсулированных полимером нематических жидких кристаллов // ЖЭТФ. 2000. Т. 71. № 12. С. 710-713.
- Parshin A.M., Gunyakov V.A., Zyryanov V.Ya., Shabanov V.F. Domain structures in nematic liquid crystals on the polycarbonate surface // Int. J. Mol. Sci. V. 14, 2013. P. 16303-16320.
- Parshin A.M., Zyryanov V.Ya., Shabanov V.F. Electric and magnetic fieldassisted orientational transitions in the ensembles of domains in a nematic liquid crystal on the polymer surface // Int. J. Mol. Sci. 2014. V. 15. P. 17838-17851.
- Parshin A.M., Zyryanov V.Ya., Shabanov V.F. The director field distribution with the strongly pinned alignment in nematic structures at the polymer surface // Liq. Cryst. 2015. V. 42. P. 57-64.

- 10. Гончаренко А.М. Гауссовы пучки света. М.: КомКнига, 2005. 144 с.
- Presnyakov V., Asatryan K., Tork A., Galstyan T., Chigrinov V. Optical polarization grating induced liquid crystal micro-structure using azo-dye command layer // Opt. Express. 2006. V. 14. 10558-10564.
- Sova O., Reshetnyak V., Galstian T., Asatryan K. Electrically variable liquid crystal lens based on the dielectric dividing principle // J. Opt. Soc. Am. A. 2015. V. 32. P. 803–808.

Рис. 1. Схема поляризационно-оптической установки для определения оптических характеристик света, проходящего через отдельный домен ЖК на поверхности ПК. 1 – лампа, 2 – зеркало, 3 – полупрозрачная пластинка, 4 – поляризатор, 5 – линза, 6 – платформа, 7 – образец, 8 – объектив, 9 – анализатор, 10 – призма, 11 – окуляр, 12 – цифровая камера, 13 – лазер, 14 – фильтр, 15 – фотодиод. В сноске показаны профиль (слева) и структура лазерного луча (справа). $I_{\text{отн}}$ – относительная интенсивность, x – расстояние от центральной оси z в поперечном сечении, 16 – гиперболический контур, w_0 – перетяжка, 17 – поверхности постоянной фазы, 18 – энергетический профиль.

Рис. 2. Микрофотография ансамбля доменов 5ЦБ, сформированных на поверхности пленки ПК в присутствии магнитного поля H = 25 кЭ. 1 -отдельный домен, 2 -линия дисклинации, 3 -пятно лазерного луча. Направления поляризации белого света показаны пересекающимися стрелками.

Рис. 3. Зависимость (во вставке в увеличенном масштабе) интенсивности I лазерного излучения с вектором поляризации $e \parallel H$, прошедшего через центр домена 5ЦБ, сформированного на поверхности ПК, от напряжения U.

Рис. 4. Зависимость (во вставке в увеличенном масштабе) интенсивности I лазерного излучения с вектором поляризации $e \perp H$, прошедшего через центр домена 5ЦБ, сформированного на поверхности ПК, от напряжения U.

Рис. 5. Структура ансамбля доменов ЖК, сформированных поверхностью ПК в присутствии магнитного поля *Н*. *1* – радиальная структура на пленке ПК,

2 – линия дисклинации, 3 – структура переходного слоя на расстоянии *z* от поверхности, 4 – планарная ориентация ЖК на длине когерентности ξ.

Рис. 6. Структура ансамбля доменов ЖК, сформированных поверхностью ПК, переориентированных под действием электрического поля *E. 1* – радиальная структура на пленке ПК, 2 – линия дисклинации, 3 – структура переходного слоя на расстоянии *z* от поверхности, 4 – гомеотропная ориентация ЖК на длине когерентности ξ_E .

Паршин Александр Михайлович, Институт физики им. Л.В. Киренского, 660036, Академгородок 50, стр. 38, Красноярск, с.т. 7(391) 249-46-00 д.т. 7(391) 249-55-27 факс 7(391) 243-89-23 e-mail <u>parshin@iph.krasn.ru</u>